

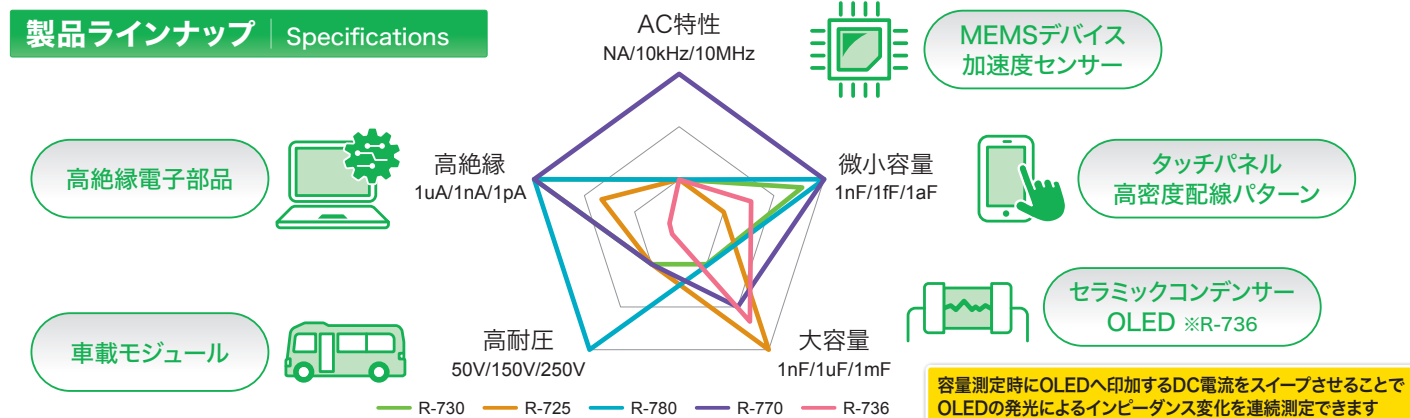


超高絶縁 Ultra-high insulation	最大検査ポイント 512ピン Maximum inspection points 512 pins
高速・高精度 High speed / high accuracy	微小容量検査高分解能 Micro-Capacity Inspection High resolution
コンパクト設計 Compact Designs	4W低抵抗測定 0.1mΩ～ 4W low resistance measurement 0.1mΩ～

●PCはオプションです。

薄膜RFフィルタ/車載DCモジュール/加速度センサ/MEMSデバイスなど あらゆる製品を検査可能！

Thin-film RF filters/Vehicle DC modules/Accelerometers/MEMS devices, Any products can be inspected!



Item		R-730 Standard	R-725 Low Impedance	R-780 High Insulation	R-770 AC Dynamic	R-736 Sweep Test
Resistance		20V/0.2mA~20mA 1mΩ~10MΩ	24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ	24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ	24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ	±10V/±40mA(OP)
Leakage		10V~50V/1mA~20mA 1MΩ~1GΩ	10V~50V/1mA~20mA 1MΩ~1GΩ	0.1V~250V/1mA~20mA 1MΩ~10TΩ	0.1V~50V/1mA~20mA 1MΩ~10TΩ	±10V/±40mA(OP)
Capacitance	Voltage	2V~15Vrms	5mV~15Vrms	5mV~15Vrms	5mV~15Vrms	100mV~5Vrms
	Frequency	10kHz~1MHz	100Hz~1MHz	1kHz~1MHz	1kHz~1MHz	1kHz
	Range	0.01pF~2000pF	1nF~10mF	0.01pF~2000pF	0.01pF~2000pF	10nF~10uF
	Min. Resolution	0.01fF	0.1pF	0.001fF	0.001fF	1pF
	Sweep Mode	NA	NA	NA	NA	AC_current, DC_current
AWG	Bandwidth				DC~20MHz	NA
	Max.UpdateRate	NA	NA	NA	50MS/s	
	Resolution				16bit	
Digitizer	Max.SampleRate	NA	NA	NA	15MS/s	NA
	Resolution				18bit	

外観及び仕様は予告なく変更になる場合があります。

国内拠点

・京都(本社)
617-0003 京都府向日市森本町東ノ口1-1 ニデックパークC棟
TEL 075-280-8101 / FAX 075-280-8106
・名古屋
503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 / FAX 0584-83-7685
・東京
141-0032 東京都品川区大崎1丁目20番13号 Nidec東京ビル
TEL 03-3494-7970 / FAX 03-3494-0793

海外拠点

・台湾
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY TAIWAN CORPORATION
・韓国
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY KOREA CO., LTD.
・中国
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY ZHEJIANG CORPORATION
・タイ
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD.
・マレーシア
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.
・ベトナム
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
・インド
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
・カナダ
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CANADA CORPORATION